

초대의 글

안녕하십니까?

연세대학교 공동기기의 발전에 보내 주신 관심과 격려에 감사 드리며,

‘제 10회 표면분석 Workshop’을 개최하게 됨을 기쁘게 생각합니다.

현재 공동기기는 총 60종류, 약 150억 상당의 연구장비를 보유하고 있습니다. 유기 분석, 무기 분석, 바이오 분석, 그리고 표면 분석 등의 분야에서 보다 전문화된 서비스를 제공하여 연구 지원과 산학협력을 강화하고자 합니다.

이번 Workshop에서는 공동기기가 보유하고 있는 FIB(집속이온빔) 소개를 비롯하여, FIB분석을 위한 전처리, 응용법, 3D Tomography에 대한 다양한 세미나가 소개될 예정입니다.

아울러 앞으로도 전자현미경분석 기술에 관한 다양한 정보를 제공해 드리도록 최선의 노력을 다하고자 합니다.

이번 행사를 통해 기초학문 산업계 연구 활동의 심화와 국제적인 연구 역량 증진에 기여 할 수 있기를 기원합니다.

2019년 10월
공동기기원장 교원건



찾아오시는 길 / 서비스 안내



- Workshop 장소 : 연세 삼성 학술정보관 7층 장기원 국제회의실
- 안내 및 납부 : 첨단과학기술관 508호

【교통편】

- 일반버스: 153,163,171,172,272,470,472,601, 606,672,673,700,710,750A,750B,751
- 광역버스: M7106,M7111,M7613,9714
- 직행버스: 1000,1100,1200,1900,2000,8880
- 공항버스: 6011
- 지하철: 2호선 신촌역 2번, 3번 출구



YCRF
Yonsei Center for Research Facilities
연세대학교 공동기기원

제 10회 표면 분석 Workshop

[3D Electron Microscopy Workshop for Multiscale Imaging]

2019. 10. 30~31
이론 및 실습
10:00 ~ 17:00

연세 삼성 학술정보관
장기원 국제회의실 F7



연세대학교
YONSEI UNIVERSITY



강의 시간표

강의 시간	강의내용	연사
09:30~10:00	등록 및 접수	
10:00~10:20	공동기기원 소개	강동영 팀장(공동기기원)
10:30~11:30	FIB 원리 및 스펙과 샘플 의뢰에 대한 해답	박병준 부장(ZEISS)
11:30~13:00	Lunch Time	
13:00~13:50	FIB단면 이미징 및 STEM 활용법	박병준 부장(ZEISS)
13:50~14:00	Break Time	
14:00~15:00	Atlas 2D & 3D 이미징	유지희 대리(ZEISS)
15:00~15:10	Break Time	
15:10~16:00	X-ray 현미경을 활용한 비파괴 분석 및 Laser	최민기 차장(ZEISS)
16:00~17:00	공동기기원 투어	

접수 안내

- **접수방법** : 공동기기원 홈페이지 → 교육신청 → 워크숍 → 제 10회 표면 분석 Workshop 선택
→ 참가신청 접수
- **참가신청 기간** : 2019년 10월 01일(화) ~ 2019년 10월 29일(화) (100명 접수인원 미달 시 현장접수 진행)
- **참가비** : 연세대학교 내부:30,000원/외부:40,000원(타 대학, 업체, 연구소등) /
실습:50,000원 (실습자에 한함)
 - 입금처 : 우리은행, 126-000343-18-563 (학) 연세대학교 (계산서 영수/청구 요청 시 발행가능)
 - 카드결제: 방문 카드결제 (첨단관 508호, 신한/비씨카드만 가능)

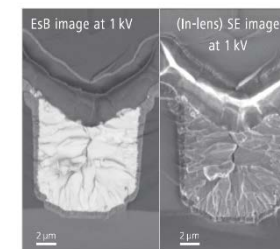
강의 자료, 점심, 다과 제공

문의 안내

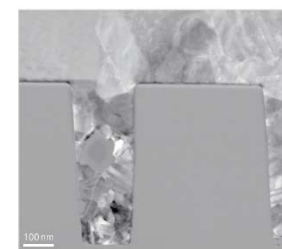
- 결제 관련: ycrf@yonsei.ac.kr, 02-2123-6970, <http://ycrf.yonsei.ac.kr>
- 워크숍 관련: choigb@yonsei.ac.kr, 02-2123-6973
- 실습은 지원자에 한함 (선착순)



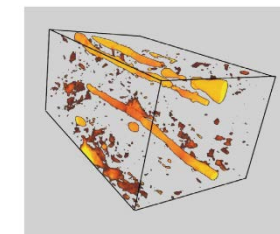
ZEISS Crossbeam 540



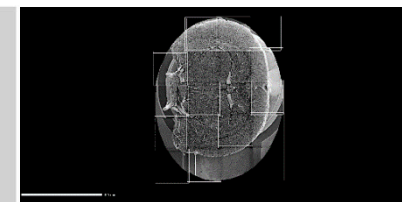
EsB



STEM



3D



2D